

## **Воронин Константин Юрьевич**

Воронин Константин Юрьевич является ведущим специалистом в области функционального тестирования СБИС.

Принимает активное участие в разработке и технологической поддержке программ функционального контроля микросхем, изготавливаемых серийно и в рамках НИОКР, проводимых институтом.

В 2019 году благодаря его непосредственному участию была разработана методика оптимизации программ тестирования, сокращающая временные затраты при тестировании сложно-функциональных микросхем и повышающая информативность результатов тестирования.

Также в 2019 году он внес большой вклад в выполнение работ по повышению выхода годных серийно выпускаемых микросхем (в частности 1890ВМ2Т и 1649РУ1Т) в технологических процессах кристального и сборочного производства, что в свою очередь позволило не допустить срывов в выполнении производственного плана института.